

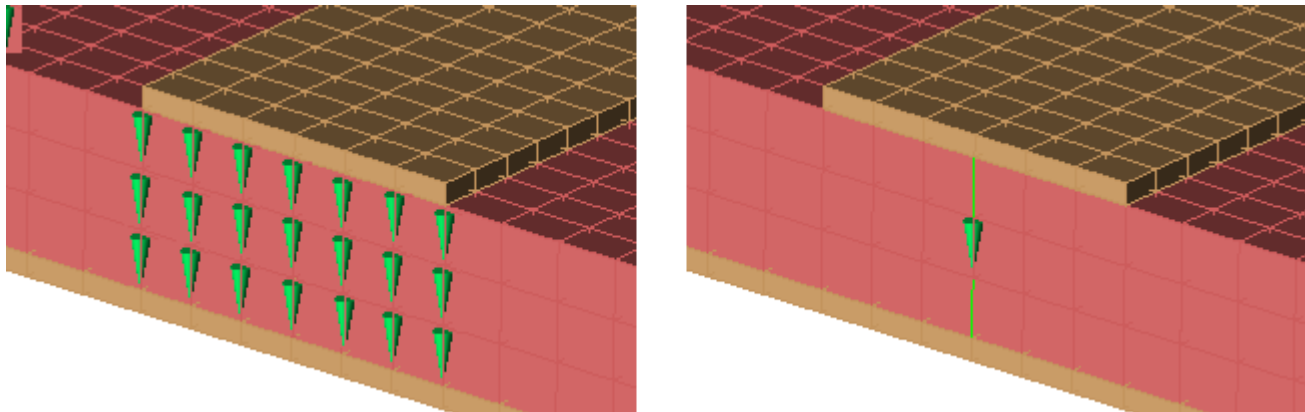
## XFDTDバージョンアップ情報 7.8.0

- 分散型ポート
- 表面電流センサー
- パーツのスライス
- 光導電性の半導体スイッチ
- オブジェクトの暗号化
- 表面粗さの設定
- Optenni Lab Integration

# 分散型ポート

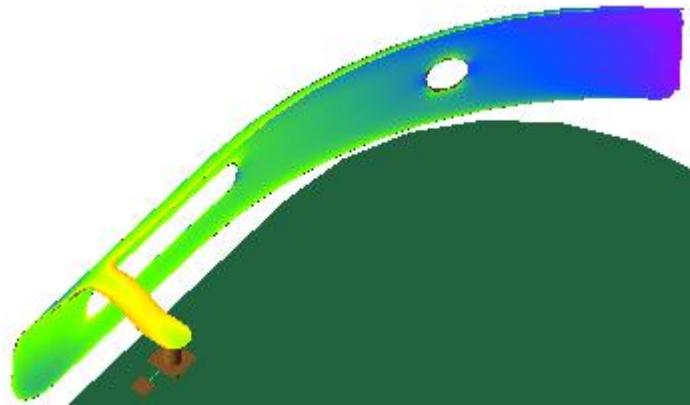
- ✓ ポート設定画面に、精度を向上させる分散オプションが追加されました。
- ✓ これを選択することで、ポートが送電線の幅全体に広がります。
- ✓ この機能は、電圧と電流密度がコンポーネントの幅に均等に分布するような伝送線路の電界分布を想定しています。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

<https://support.remcom.com/xfDTD/knowledge-articles/excitations/distributed-circuit-component.html>



- ✓ 表面電流センサーは、金属表面の電流を計算することができます。
- ✓ 主にデュアルバントのアンテナに使用されます。
- ✓ ユーザーは、アンテナのみの表面電流を見ることができます。
- ✓ このセンサは、導電性の良い部品であればどのような部品でもデータを収集することができ、XACTと階段状の部品の両方に対応しています。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

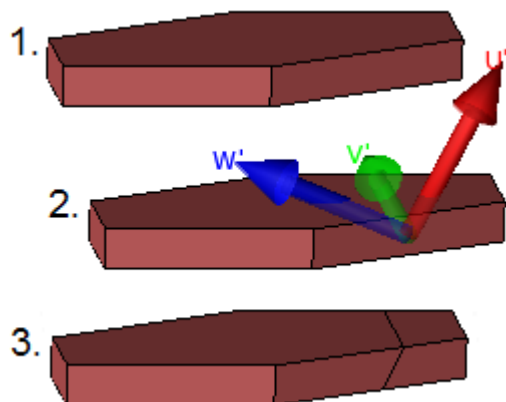
<https://support.remcom.com/xfdtd/reference/sensors/surface-current-sensor.html>



# パーツのスライス

- ✓ XFDTDのスライス操作は、1つのパーツを2つのパーツにカットします。
- ✓ この操作は、アンテナの給電構造の再設計が必要な場合など、不要な部分を切り離して削除するために活用できます。
- ✓ また、複数の部品を同時にスライスすることもできます。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

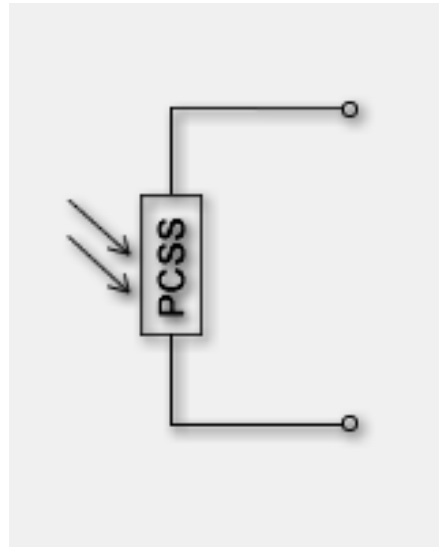
<https://support.remcom.com/xfDTD/reference/3d-modeling/slice.html>



# 光導電性の半導体スイッチ

- ✓ 光導電性の半導体スイッチ(PCSS)コンポーネントは、光が照射されたときに導電性を持つ半導体デバイスを模擬します。
- ✓ PCSSコンポーネントは、時間領域の結果のみを知りたい場合に使用してください。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

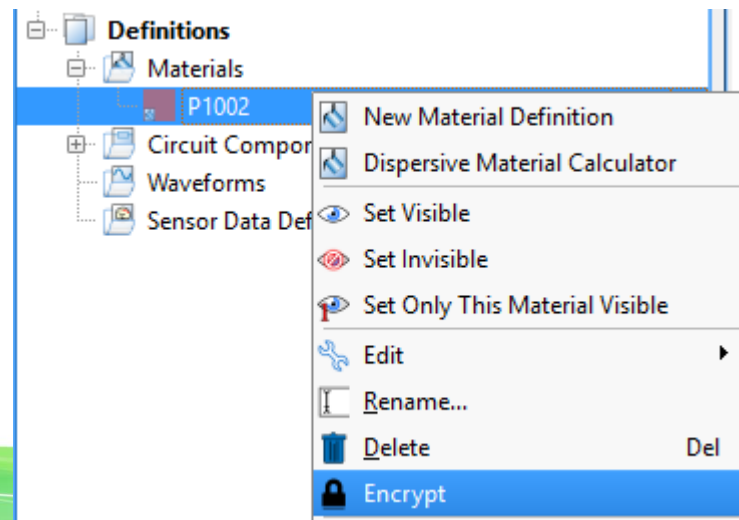
<https://support.remcom.com/xfDTD/reference/circuit-component-definitions/pcss.html>



# オブジェクトの暗号化

- ✓ ユーザーは、オブジェクトの関連情報を保護するために、材質や回路部品をパスワードで保護することができます。
- ✓ 暗号化された情報は、パスワードを再入力することで閲覧および編集することができます。
- ✓ この暗号化により、オブジェクトに関連付けられた知的財産は許可されたユーザーのみがアクセスできるようになり、社外のユーザーとのプロジェクトの共有が可能になります。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

<https://support.remcom.com/xfddt/reference/general/object-encryption.html>



# 表面粗さの設定

- ✓ 例えば銅の表面粗さは、電流の抵抗を発生させ電力損失を引き起こすことで導電性に影響を与えます。
- ✓ 周波数が高くなると、理想的な完全に滑らかな表面の電流との偏差が大きくなり、効率が低下します。
- ✓ ユーザーは、マテリアルエディタで表面粗さを調整することで、この偏差をコントロールすることができ、導電率損失と効率への影響を評価することができます。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

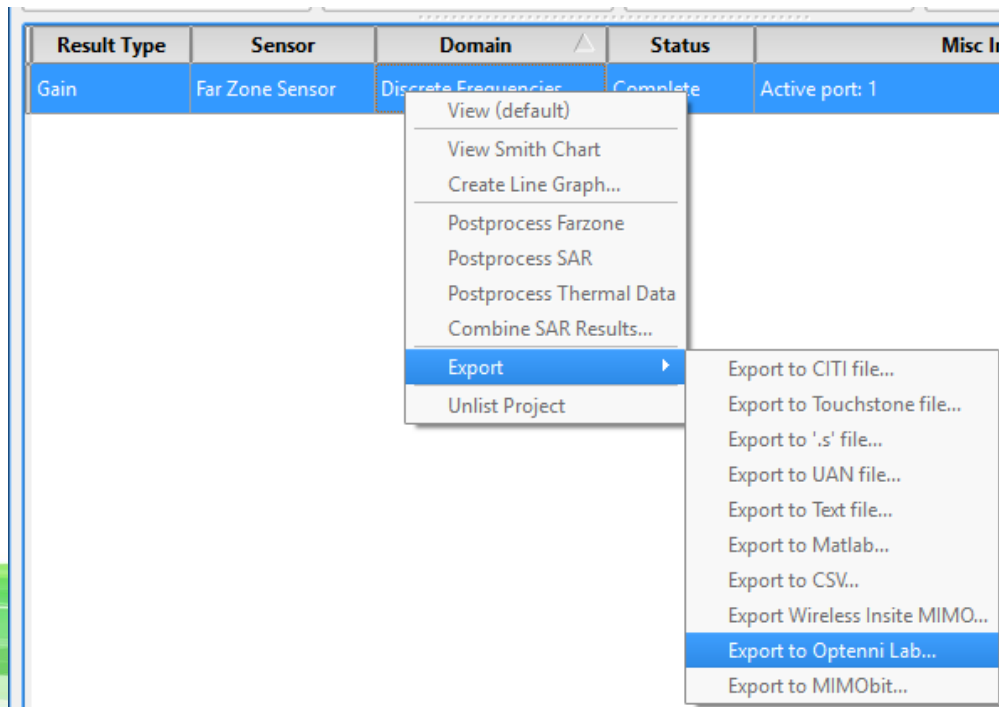
<https://support.remcom.com/xfddt/reference/materials/electric-nondispersive.html>

Type:	Nondispersive
Entry Method:	Normal
Good Conductor:	Automatic
	<input checked="" type="checkbox"/> Surface Conductivity Correction
Conductivity:	5.98e+07 S/m
Relative Permittivity:	1
Evaluation Frequency:	4.2 GHz
Surface Roughness:	1.3 um

# Optenni Lab Integration

- ✓ Optenni Lab 4.2のサポートが追加されました。
- ✓ 3次元の放射パターンを選択する際、XFDTDの結果ブラウザの右クリックメニューからOptenni Labにエクスポートできるようになりました。
- ✓ 詳細は開発元のWebサイトをご確認ください。

<https://support.remcom.com/xfDTD/reference/optenni-lab/optenni-lab-integration.html#Export>





# 開発元のバージョンアップ情報ページ

この他のバージョンアップ項目や詳細情報は開発元のWebサイトよりご確認ください。

<https://support.remcom.com/xfdtd/releases/release-7-8-0.html>